

## РАСЧЕТ АНОМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ХОЛЛА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ТЕРМООБРАБОТАННОМ ОБРАЗЦЕ *n*-Ge

Ван Си-фу, Син Сюй, Цзян Вэй

С помощью модели инверсионного слоя рассматривается аномальный эффект Холла при комнатной температуре в термообработанном (при  $T=670^{\circ}\text{C}$ ) образце *n*-Ge. Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными.

**Введение.** Известно, что для описания аномального эффекта Холла при низкой или сверхнизкой температуре предложено несколько теоретических моделей [1-5]. Однако недавно были обнаружены серии аномальных электромагнитных свойств полупроводника при комнатной температуре [6-9].

В работе [10] обсуждалась аномальная температурная зависимость коэффициента Холла на образце InAs при постоянном напряжении и низкой температуре. Авторы [10] развили теорию инверсионного слоя и успешно объяснили указанные аномалии. После этого в работе [11] на образце *p*-InAs эта модель была подтверждена экспериментально.

В нашей работе, согласно модели инверсионного слоя [10], вычислен аномальный эффект Холла при комнатной температуре на термообработанном при  $670^{\circ}\text{C}$  образце *n*-Ge. Полученный результат соответствует экспериментальным данным [6].

### Вывод формул

Условия эксперимента, при которых наблюдался аномальный эффект Холла в образце *n*-Ge, следующие: сила тока  $I$  постоянна, разность потенциалов Холла  $V_H$  и разность потенциалов проводимости  $V_s$  измеряются в разомкнутой цепи.

Как и авторы работы [10], будем для удобства считать, что образец и его внутренняя инвертированная область *p*-типа проводимости имеют вид прямоугольных параллелепипедов. Обозначим длины ребер образца  $a$ ,  $b$ ,  $l$ , а толщину поверхности слоя *n*-типа проводимости  $d_s$ . Тогда длины ребер внутренней области *p*-типа проводимости будут соответственно равны  $d_a = a - 2d_s$ ,  $d_b = b - 2d_s$ ,  $d_l = l - 2d_s$ . На рис. 1, *a* показаны стереотомические фигуры слоя *n*-типа проводимости.

1. Полный эффективный коэффициент Холла образца. С учетом симметрии областей 11 и 12, 21 и 22, 31 и 32 (рис. 1, *a*) эквивалентная цепь полной эффективной холловской разности потенциалов  $V_H$  представлена на рис. 1, *b*.

Выражение для полного эффективного коэффициента Холла имеет вид

$$R = \frac{bV_H}{IB} = b \left\{ \left[ \frac{2R_n \sigma_n d_l d_s}{ab - d_a d_b} \left( 1 - \frac{J_s d_a d_b}{I} \right) + \frac{2R_n \sigma_n d_s}{a} + \frac{R_p \sigma_p J_s e d_l}{e J_s d_a + 2kT \sigma_p} \frac{J_s d_a d_b}{I} \right] \times \right. \\ \left. \times \frac{d_n (e J_s d_u + 2kT \sigma_p)}{\sigma_p J_s e d_a d_b d_l + 2\sigma_n (b + d_l) (e J_s d_u + 2kT \sigma_p) d_s} \right\} + \frac{2R_n b d_s}{ab - d_a d_b} \left( 1 - \frac{J_s d_a d_s}{I} \right), \quad (1)$$

где  $R_n$ ,  $R_p$  — коэффициенты Холла,  $\sigma_n$ ,  $\sigma_p$  — электропроводности для электронов и дырок;

$$R_n = \frac{\mu_H}{\mu} \frac{p_n u_p^2 - n_n u_n^2}{e(p_n u_p + n_n u_n)^2}, \quad R_p = \frac{p_p u_p^2 - n_p u_n^2}{e(p_p u_p + n_p u_n)^2}, \quad (2)$$

$$\sigma_n = e(p_n u_p + n_n u_n), \quad \sigma_p = e(p_p u_p + n_p u_n).$$

а плотность обратного тока насыщения  $J_s$  для  $p-n$ -перехода

$$J_s = \sqrt{\frac{ekT}{\pi}} (\sqrt{\mu_n} n_p + \sqrt{\mu_p} p_n). \quad (3)$$

Концентрация электронов в  $p$ -области  $n_p$ , концентрация дырок в  $n$ -области  $p_n$  и концентрация собственных носителей тока  $n_i$  соответственно равны  $n_p = n_i^2/n_n$ ,  $p_n = n_i^2/p_p$ ,  $n_i = 4.82 \cdot 10^{15} (m_p^* m_n^*/m_0^2)^{1/2} T^{3/2} e^{-E_g/2kT}$ .

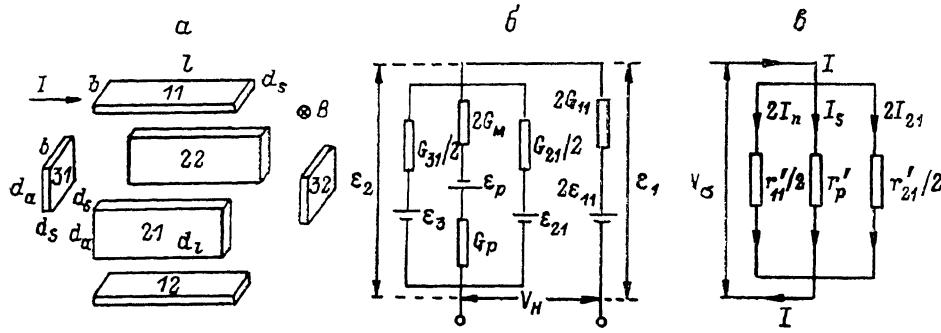


Рис. 1. Стереотомические фигуры области слоя  $n$ -типа проводимости (а), эквивалентные схемы полной эффективной холловской разности потенциалов  $V_H$  (б) и полной разности потенциалов  $V_s$  проводимости образца (с).

В области полной ионизации

$$n_n = N_D, \quad p_p = N_A. \quad (4)$$

В области перехода

$$n_n = \frac{N_D}{2} \left[ 1 + \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2} \right)^{1/2} \right], \quad p_p = \frac{N_A}{2} \left[ 1 + \left( 1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2} \right)^{1/2} \right]. \quad (4')$$

В области собственной проводимости

$$n_n = n_i, \quad p_p = n_i, \quad (4'')$$

где  $n_n$ ,  $p_p$  — концентрации электронов и дырок в  $n$ - и  $p$ -областях соответственно,  $N_D$  — концентрация нескомпенсированных доноров в  $n$ -области,  $N_A$  — концентрация нескомпенсированных акцепторов в  $p$ -области,  $\tau$  — время жизни носителей,  $\mu_H$  — подвижность Холла,  $\mu_n$ ,  $\mu_p$  — подвижности электронов и дырок соответственно.

2. Полная эффективная удельная электропроводность. Так как электроды, на которых измеряется проводимость, находятся между двумя  $p-n$ -переходами

Таблица 1

$T, K$	$R, \text{см}^2/\text{с}$	$\sigma, \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$
300	-7678	0.1647
305	-58.78	0.1703
310	1173	0.1743
325	2105	0.1732
340	1037	0.1761
345	394.9	0.1815
350	-315.7	0.1904

Таблица 2

$I, \text{mA}$	$T, K$	Расчетные значения	Экспериментальные значения
1.09	$T_1$	306	301
	$T_2$	348	346
8.28	$\Delta T$	305 $\div$ 345	300 $\div$ 342
	$T_1$	316	313
	$T_2$	348	348

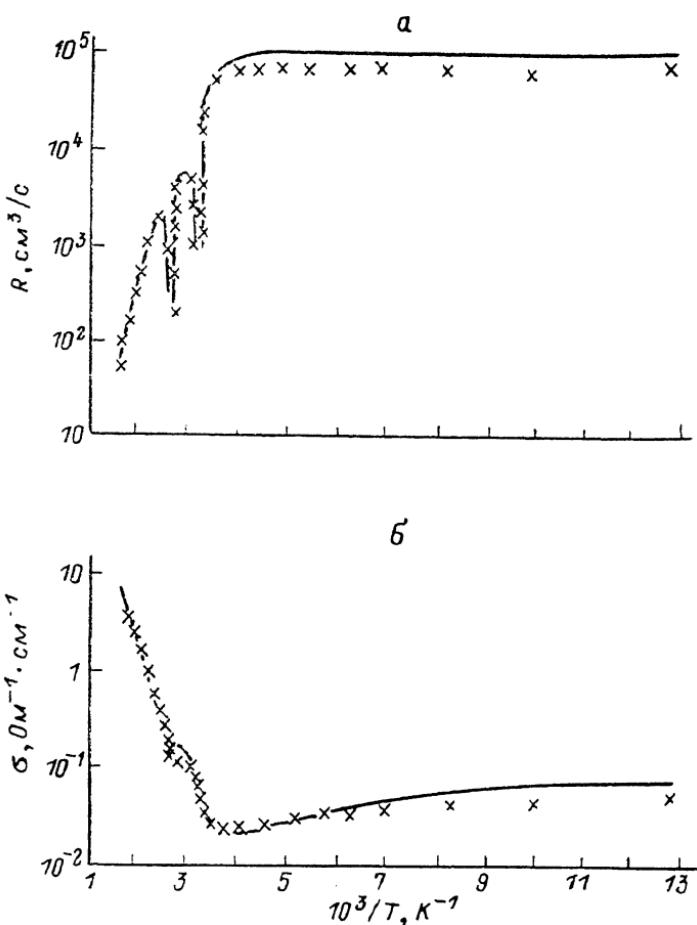


Рис. 2. Зависимости коэффициента Холла (а) и проводимости (б) от температуры. Сплошные линии — расчет, точки — эксперимент.  $I=1.09$  мА,  $B=1.00$  кГс.

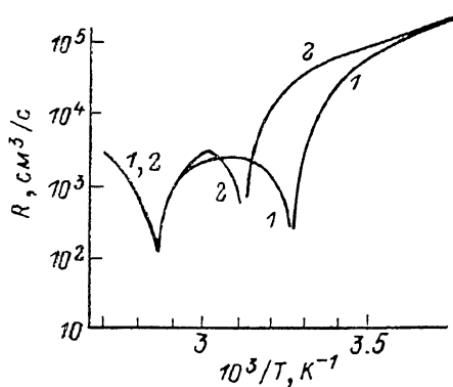


Рис. 3. Расчетные кривые  $\lg R \sim 1/T$  для разных значений тока  $I$ , мА: 1 — 1.09, 2 — 8.28.

по направлению  $I$ , эквивалентная цепь полной разности потенциалов  $V$ , проводимости образца имеет вид, приведенный на рис. 1, в. Отсюда получаем выражение для полной эффективной удельной электропроводности

$$\sigma = \frac{l_v I}{V_s ab} = \frac{\sigma_n (ab - d_a d_b)}{ab (l - l_s) d_a d_b}. \quad (5)$$

Подставляя соответствующие величины (2)–(4) в выражения (1) и (5), получим температурные зависимости  $R$  и  $\sigma$ .

### Результаты расчета

Область численных значений параметров  $N_D$ ,  $N_A$ ,  $d_s$ ,  $\tau$  оценивалась по температурной зависимости подвижности носителей тока, причем подвижность за счет рассеяния на колебаниях решетки учитывалась в виде  $\mu_n = 4.90 \times 10^7 T^{-1.66}$ ,  $\mu_p = 1.05 \cdot 10^9 T^{-2.33}$  см<sup>2</sup>/В·с. Оптимальные значения параметров определялись с помощью ЭВМ путем подгонки расчетных зависимостей  $\lg R$  и  $\lg \sigma$  от обратной температуры к экспериментальным данным при  $I=1.09$  мА и  $B=1.00$  кГс (рис. 2). Были получены следующие значения:  $d_s=0.02$  см,  $\tau=0.10$  мкс,  $N_D=1.7 \cdot 10^{14}$  и  $N_A=7.5 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup>.

Результаты расчетов  $R$  и  $\sigma$  в области температур, где происходит изменение знака коэффициента Холла, приведены в табл. 1. В табл. 2 приведены расчетные и экспериментальные значения точек инверсии и температурного интервала, в котором  $R > 0$ , для  $I=1.09$  и 8.28 мА,  $B=1.00$  кГс. На рис. 3 для этих же значений токов и магнитного поля показаны расчетные зависимости коэффициента Холла от температуры. Как следует из рис. 2 и табл. 2, расчетные значения хорошо согласуются с экспериментальными.

### Список литературы

- [1] Городилов Н. А., Демчук К. М., Миньков Г. М., Нейфельд Э. А. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 5. С. 798–803.
- [2] Брандт Н. Б., Дмитриев В. В., Ладыгин Е. А., Скипетров Е. П. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 3. С. 514–520.
- [3] Венгашем M., Walsh D., Mazuruk K. // Sol. St. Commun. 1987. V. 71. N 12. P. 803–805.
- [4] Ведяев А. В., Граневский А. Б. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 8. С. 2310–2313.
- [5] Coleman P., Anderson P. W., Ramakrishnan T. V. // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 55. N 4. P. 414–417.
- [6] Xing Xu // Kexue Tongbao (Sci. Bull. Beijing, China). 1986. V. 31. N 19. P. 1313–1315.
- [7] Xing Xu // Kexue Tongbao (Sci. Bull. Beijing, China). 1987. V. 32. N 11. P. 737–739.
- [8] Xing Xu., Yang Chun-Fang // Kexue Tongbao (Beijing, China). 1987. V. 32. N 24. P. 1857–1860.
- [9] Бойков Ю. А., Кутасов В. А. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 1. С. 297–300.
- [10] Воронков В. В., Соловьева Е. В., Иглицын М. И., Пивоваров М. Н. // ФТП. 1968. Т. 2. В. 12. С. 1800–1808.
- [11] Гусев О. К., Киреенко В. П., Ломтев А. А., Яржембицкий В. Б. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 6. С. 1153–1155.

Северо-Восточный педагогический университет  
Чанчунь, КНР  
Ляо'янский нефтехимический технический институт  
Ляо'ян, КНР

Получена 16.03.1989  
Принята к печати 4.10.1989